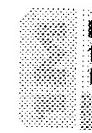


[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome
United States Patent and Trademark Office

» See

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**[Welcome to IEEE Xplore](#)

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

[Member Benefits](#)

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

[Search](#)

- By Author
- Basic
- Advanced

[Member Services](#)

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

[Enterprise Services](#)

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

 [Print Format](#)[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved